

改正案				現 行			
埼玉県産業技術総合センター条例 第一条～第十四条 (略)				埼玉県産業技術総合センター条例 第一条～第十四条 (略)			
(使用料等)				(使用料等)			
第十五条 利用権利者は、別表第一に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。				第十五条 利用権利者は、別表第一に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。			
2 依頼試験を依頼しようとする者及び別表第二第二号の表に掲げる試験成績書の複本等の交付を受けようとする者は、別表第二に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。				2 依頼試験を依頼しようとする者及び別表第二第二号の表に掲げる試験成績書の複本等の交付を受けようとする者は、別表第二に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。			
第十六条～第十八条 (略)				第十六条～第十八条 (略)			
別表第一 (第十五条関係)				別表第一 (第十五条関係)			
一 試験研究機器				一 試験研究機器			
種類	名称	単位	金額	種類	名称	単位	金額
一～四 (略)	(略)	(略)	(略)	一～四 (略)	(略)	(略)	(略)
五 測定機器	イ～ト (略)	(略)	(略)	五 測定機器	イ～ト (略)	(略)	(略)
	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>		<u>チ 蛍光X線膜厚計</u>	<u>一時間</u>	<u>七四〇円</u>
	<u>チ 電磁式・渦電流式膜厚計</u>	一時間	一三〇円		<u>リ 電磁式・渦電流式膜厚計</u>	一時間	一三〇円
	<u>リ 混練抵抗測定装置</u>	一時間	九九〇円		<u>ヌ 混練抵抗測定装置</u>	一時間	九九〇円
	<u>ヌ メルトインデクサ</u>	一時間	二一〇円		<u>ル メルトインデクサ</u>	一時間	二一〇円
	<u>ル 粒度分布測定装置</u>	一時間	二五〇円		<u>ヲ 粒度分布測定装置</u>	一時間	二五〇円
	<u>ヲ 画像解析付粒度分布測定装置</u>	一時間	六〇〇円		<u>ワ 画像解析付粒度分布測定装置</u>	一時間	六〇〇円
	<u>ヅ 色差計・光沢計</u>	一時間	二〇〇円		<u>カ 色差計・光沢計</u>	一時間	二〇〇円
	<u>カ 接触角測定装置</u>	一時間	六八〇円		<u>コ 接触角測定装置</u>	一時間	一九〇円
	<u>ク カールフィッシャー水分計</u>	一時間	六〇円		<u>タ カールフィッシャー水分計</u>	一時間	六〇円
	<u>ク 食品用熱分析システム</u>	一時間	三八〇円		<u>セ 食品用熱分析システム</u>	一時間	三八〇円
	<u>ケ 動的粘弾性測定装置</u>	一時間	三一〇円		<u>ソ 動的粘弾性測定装置</u>	一時間	三一〇円

改 正 案				現 行				
六 試料調 製機器	ソ	ファリノグラフ	一時間	一三〇円	ソ	ファリノグラフ	一時間	一三〇円
	ツ	クリーブ試験装置	一時間	二五〇円	ネ	クリーブ試験装置	一時間	二五〇円
	ネ	精密力量測定機	一時間	七〇円	ナ	精密力量測定機	一時間	七〇円
	ナ	香気成分測定装置	一時間	三三〇円	ラ	香気成分測定装置	一時間	三三〇円
	ラ	振動式密度計	一時間	二〇〇円	ム	振動式密度計	一時間	二〇〇円
	ム	アルコールアナライザ	一時間	四八〇円	ウ	アルコールアナライザ	一時間	四八〇円
		(削る)	(削る)	(削る)	キ	米粒食味計	一時間	一一〇円
	ウ	ビスコアミログラフ	一時間	一四〇円	ノ	ビスコアミログラフ	一時間	一四〇円
	キ	発酵モニタ	一時間	一〇〇円	オ	発酵モニタ	一時間	一〇〇円
	ノ	分光測色計	一時間	一五〇円	ク	分光測色計	一時間	一五〇円
		(削る)	(削る)	(削る)	ヤ	色差計	一時間	一四〇円
	オ	光電光沢計	一時間	五〇円	マ	光電光沢計	一時間	五〇円
	ク	味覚センサ	一時間	四、三〇〇円	ケ	味覚センサ	一時間	四、三〇〇円
		(削る)	(削る)	(削る)	イ	窒素雰囲気焼入炉	一時間	六三〇円
	イ	窒素雰囲気焼入炉	一時間	三八〇円	ロ	窒素雰囲気焼入炉	一時間	三八〇円
	ロ	高温電気炉	一時間	五二〇円	ハ	高温電気炉	一時間	五二〇円
	ハ	卓上電気炉	一時間	一、四一〇円	ニ	卓上電気炉	一時間	一、四一〇円
		(削る)	(削る)	(削る)	ホ	電気炉	一時間	一八〇円
	ニ	マッフル炉	一時間	三二〇円	ヘ	マッフル炉	一時間	三二〇円
	ホ	炭化焼成炉	一時間	四八〇円	ト	炭化焼成炉	一時間	四八〇円
	ヘ	連続式ロータリーキルン	一時間	四二〇円	チ	連続式ロータリーキルン	一時間	四二〇円
	ト	熱風循環式乾燥機	一時間	一八〇円	リ	熱風循環式乾燥機	一時間	一八〇円
	チ	超微粒子粉碎機（工業材料用）	一時間	一三〇円	ヌ	超微粒子粉碎機（工業材料用）	一時間	一三〇円
	リ	超微粒子粉碎機（食品用）	一時間	二三〇円	ル	超微粒子粉碎機（食品用）	一時間	二三〇円
	ヌ	マルチミル（食品用）	一時間	四二〇円		(新設)	(新設)	(新設)
	ル	試料粉碎装置	一時間	一一〇円	ヲ	試料粉碎装置	一時間	一一〇円
	ヲ	粉碎機	一時間	七〇円	ワ	粉碎機	一時間	七〇円
	ワ	造粒機	一時間	一一〇円	カ	造粒機	一時間	一一〇円
	カ	二軸エクストルーダ	一時間	五六〇円	ヨ	二軸エクストルーダ	一時間	五六〇円
	ヨ	かくはん機	一時間	九〇円	タ	かくはん機	一時間	九〇円
タ	分離用小型超遠心機	一時間	二七〇円	レ	分離用小型超遠心機	一時間	二七〇円	

改 正 案				現 行			
	レ 真空凍結乾燥機	一時間	四二〇円		ソ 真空凍結乾燥機	一時間	四二〇円
	ソ 食品用乾燥機	一時間	一九〇円		(新設)	(新設)	(新設)
	ツ～ラ (略)	(略)	(略)		ツ～ラ (略)	(略)	(略)
七 (略)	(略)	(略)	(略)	七 (略)	(略)	(略)	(略)
八 評価試験機器	イ～ヨ (略)	(略)	(略)	八 評価試験機器	イ～ヨ (略)	(略)	(略)
	(削る)	(削る)	(削る)		タ 剥離試験機	一時間	八〇円
九 分析機器	イ～ル (略)	(略)	(略)	九 分析機器	イ～ル (略)	(略)	(略)
	ヲ 顕微ラマン分光光度計	一時間	四、〇〇〇円		(新設)	(新設)	(新設)
	ワ 自記分光光度計	一時間	二八〇円		ヲ 自記分光光度計	一時間	二八〇円
	カ 有機酸分析システム	一時間	二五〇円		ワ 有機酸分析システム	一時間	二五〇円
	ヨ グルコースアナライザ	一時間	八〇円		カ グルコースアナライザ	一時間	八〇円
十 (略)	(略)	(略)	(略)	十 (略)	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

二～五 (略)

別表第二 (第十五条関係)

一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額
一 分析	イ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	ロ 機器分析	(1)～(15) (略)	(略)	(略)	(略)
		(16) 顕微ラマン分光光度計による分析	試料分析 イメージング	一試料 一測定 一時間	九、八二〇円 一五、二〇〇円 (一時間を増すごとに六、九〇〇円を加える。)
		(17) 熱分析装置による分析		一試料 一測定	三、八八〇円
		(18) X線回折装置による分析		一試料 一測定	九、七七〇円

備考 (略)

二～五 (略)

別表第二 (第十五条関係)

一 依頼試験

大分類	中分類	小分類	細目	単位	金額
一 分析	イ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	ロ 機器分析	(1)～(15) (略)	(略)	(略)	(略)
		(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
		(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
		(16) 熱分析装置による分析		一試料 一測定	三、八八〇円
		(17) X線回折装置による分析		一試料 一測定	九、七七〇円

改 正 案					現 行						
		(19) アルコールアナライザによる定量分析		一試料 一測定	二、四二〇円			(18) アルコールアナライザによる定量分析		一試料 一測定	二、四二〇円
		(20) 味覚センサによる分析	酸味、塩味、苦味、旨味及び渋味測定	一試料 一測定	一四、三〇〇円 (一試料を増すごとに四、三七〇円を加える。)			(19) 味覚センサによる分析	酸味、塩味、苦味、旨味及び渋味測定	一試料 一測定	一四、三〇〇円 (一試料を増すごとに四、三七〇円を加える。)
			酸味、塩味、苦味、旨味、渋味及び甘味測定	一試料 一測定	一九、八〇〇円 (一試料を増すごとに五、一九〇円を加える。)				酸味、塩味、苦味、旨味、渋味及び甘味測定	一試料 一測定	一九、八〇〇円 (一試料を増すごとに五、一九〇円を加える。)
二 材料試験	イ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)	二 材料試験	イ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
	ロ 物理試験	(1)~(7) (略)	(略)	(略)	(略)		ロ 物理試験	(1)~(7) (略)	(略)	(略)	(略)
		(8) 粒度分布試験		一試料 一項目	五、三三〇円			(8) 粒度分布試験		一試料 一項目	五、三三〇円
		(9) <u>ぬれ性試験</u>		<u>一試料</u> <u>一測定</u>	<u>三、三〇〇円</u> <u>(一測定を増すごとに九三〇円を加える。)</u>			<u>(新設)</u>		<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
	ハ・ニ	(略)	(略)	(略)	(略)		ハ・ニ	(略)	(略)	(略)	(略)
	ホ 表面処理試験	(1) 膜厚測定		一試料 一層	六〇〇円		ホ 表面処理試験	(1) 膜厚測定	電解式によるもの	一試料 一層	六〇〇円
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>				蛍光X線式によるもの	<u>一試料</u> <u>一層</u>	<u>二、二一〇円</u> <u>(一層を増すごとに四〇〇円を加える。)</u>
		(2)~(4) (略)	(略)	(略)	(略)			(2)~(4) (略)	(略)	(略)	(略)
		(5) 複合サイクル試験		二四時間	八、九三〇円 (二四時間までを増すごとに四、七三〇円を加える。)			(5) 複合サイクル試験		二四時間	八、九三〇円 (二四時間までを増すごとに四、七三〇円を加える。)

改 正 案						現 行					
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>			<u>(6) 雰囲気熱処理試験</u>		<u>一込め</u>	<u>二、六九〇円</u>
	へ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)		へ (略)	(略)	(略)	(略)	(略)
三 測定及 び検査	イ 精密 測定	(1)~(7) (略)	(略)	(略)	(略)		イ 精密 測定	(1)~(7) (略)	(略)	(略)	(略)
		(8) 非接触三次元測定 機による測定		一試料 一測定	一五、五〇〇円 (一測定を増す ごとに五、七八 〇円を加える。)			(8) 非接触三次元測定 機による測定		一試料 一測定	一五、五〇〇円 (一測定を増す ごとに五、七八 〇円を加える。)
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>			<u>(9) ねじの測定</u>		<u>一試料</u> <u>一測定</u>	<u>五二〇円</u>
	ロ・ハ	(略)	(略)	(略)	(略)		ロ・ハ	(略)	(略)	(略)	(略)
四~六(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	四~六(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
七 調製	試験片調 製	(1)~(3) (略)	(略)	(略)	(略)		試験片調 製	(1)~(3) (略)	(略)	(略)	(略)
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>			<u>(4) 衝撃試験片調製</u>		<u>三〇分</u>	<u>一、七五〇円</u>
		<u>(4) 硬さ試験片調製</u>		三〇分	五九〇円			<u>(5) 硬さ試験片調製</u>		三〇分	五九〇円
		<u>(5) 顕微鏡試験片調製</u>		三〇分	七六〇円			<u>(6) 顕微鏡試験片調製</u>		三〇分	七六〇円
		<u>(6) X線マイクロアナ ライザ試験片調製</u>		三〇分	一、三五〇円			<u>(7) X線マイクロアナ ライザ試験片調製</u>		三〇分	一、三五〇円
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>			<u>(8) 工芸材料試験片調 製</u>		<u>三〇分</u>	<u>一、一〇〇円</u>
		<u>(削る)</u>		<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>			<u>(9) 精密研磨器による 調製</u>		<u>三〇分</u>	<u>二、六一〇円</u>
		<u>(7) 平面ミリング装置 による調製</u>		一試料	九一〇円			<u>(10) 平面ミリング装置 による調製</u>		一試料	九一〇円
八・九(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	八・九(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
備考 (略)						備考 (略)					
二 (略)						二 (略)					